

PSS WT-8501

光通信 VCSEL 测试机 ▶▶▶



产品简介

普赛斯光通信 VCSEL 测试机用于面发射类型 VCSEL 的 Wafer 测试，支持芯片的 LIV、光谱相关参数的测试，视觉自动识别，全自动完成每一颗芯片的测试；支持常温、高温双温测试，高温测试温度可由用户自定。兼容多种不同尺寸的 Wafer，向用户开放测量数据库，用于后续筛分工序。

产品应用

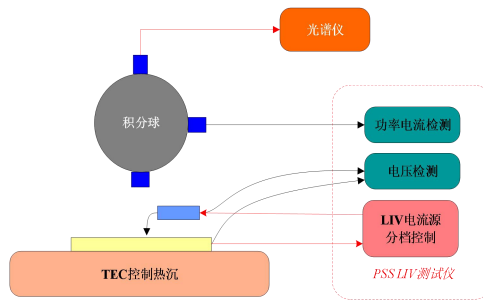
- 光通信等应用的 VCSEL 芯片测试
- 小功率面发射芯片的验证测试

产品特点

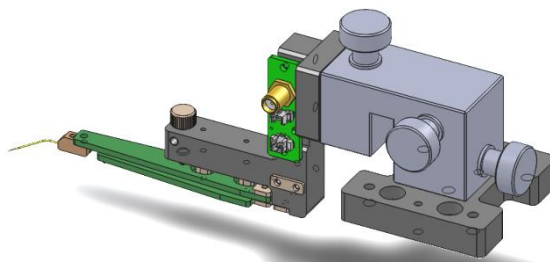
- 集成自制 LIV 综合测试仪，小电流挡位精度高，支持 LIV 测试



- 积分球同步收光，支持 LIV 测试和光谱测试

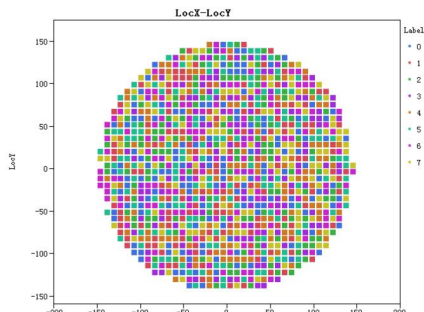


- 探针臂，针压可调，最小调到 1g，压力稳定性在 $\pm 0.1g$ 以内，探针安装带限位功能



- 支持晶圆位置识别和自动调整
- 测试载台采用高导热材料，TEC 温控，温度范围可支持 25~85°C
- 支持快速光谱测试

- 软件支持精确定位图、坐标数据生成，数据库自动存储数据及图片



技术参数

参数	指标
适合 Wafer 尺寸	2 寸、4 寸和 6 寸
芯片加电方式	支持同面和异面类型的 VCSEL 加电
电流范围	范围 0-500mA
电流输出和测量精度	0~20mA: 0.1%FS±0.1mA 0~100mA: 0.1%FS±0.1mA 0~250mA: 0.1%FS±0.25mA 0~500mA: 0.1%FS±0.5mA
电流加电方式	支持连续电流扫描, 和脉冲加电: 脉宽 200us~650ms, 周期 2ms~6s, 同步输出触发信号
前光功率	范围 0-500mW, 精度 0.1%FS±50uW
正向电压	范围 0-5V, 精度 0.5%±50mV
波长范围	800-1700 nm, 其他波长支持定制
测试台温控范围	25 ~ 85°C, 稳定性<±1°C
设备尺寸	不含信号灯及显示器, 1250mm(深)×1100mm(宽)×1750mm(高)
气源要求	正压: 无 负压: ≤ -80KPa
电源	AC 220V/16A 50Hz